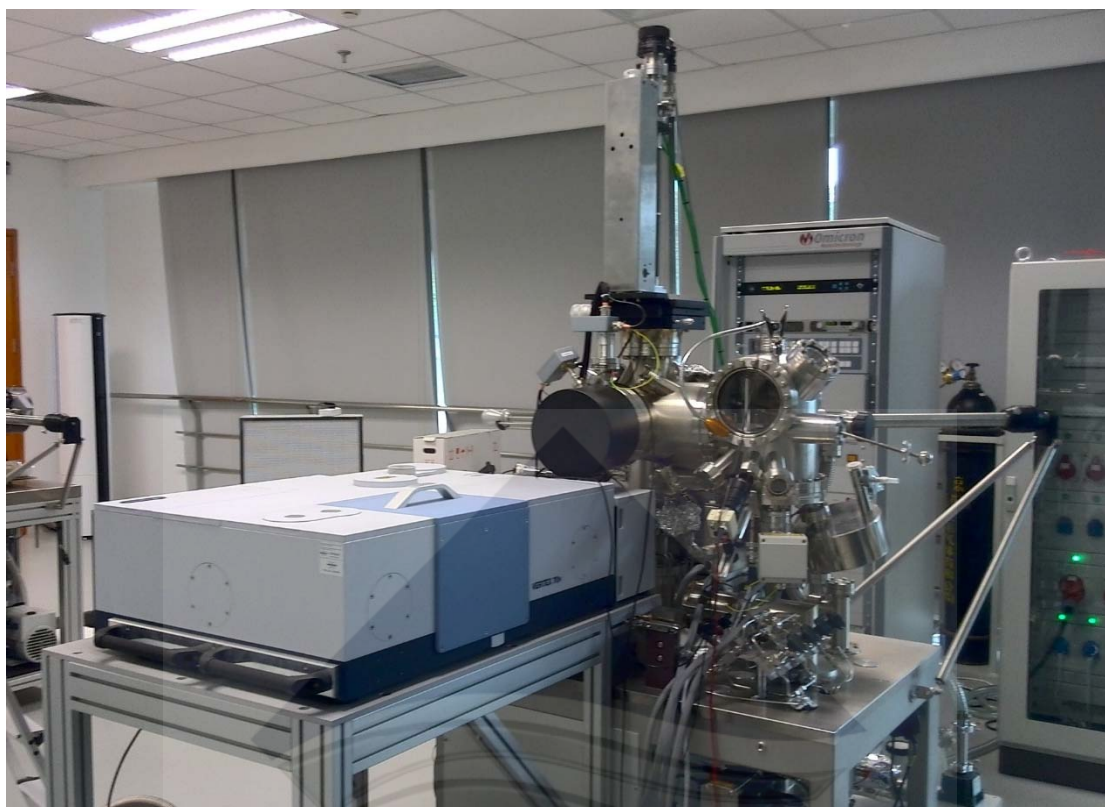


## 吸收反射红外、扫描隧道显微镜联用超高真空系统



型号	RAIRS VT-AFM System
仪器指标	超高真空： $< 3 \times 10^{-10}$ mbar； 扫描探针显微镜 STM/AFM；傅里叶变换红外光谱 FTIR； 低能电子衍射/俄歇能谱 LEED/AES； 程序升温脱附 TPD；
分析能力	单晶表面吸附物种红外检测、二维体系形貌分析
仪器特色	研究金属单晶及负载在金属单晶上的颗粒或薄膜的结构和吸附特征，红外谱可以设定 1 个波数分辨率，可以测定 $10^{-11}$ mbar 到 $10^{-5}$ mbar 气氛中表面吸附物种的变化，扫描隧道显微镜可以给出样品表面的原子尺度结构信息；